



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES  
ACADÊMICAS



EMITIDO EM 29/02/2024 09:36

**RESUMO DO COMPONENTE CURRICULAR**

**Dados Gerais do Componente Curricular**

<b>Tipo do Componente Curricular:</b>	DISCIPLINA
<b>Unidade Responsável:</b>	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA INDUSTRIAL (PEI) (12.01.23.28)
<b>Código:</b>	PEI0066
<b>Nome:</b>	MICROSCOPIA DE FORÇA ATÔMICA
<b>Carga Horária Teórica:</b>	30 h.
<b>Carga Horária Prática:</b>	0 h.
<b>Carga Horária Total:</b>	30 h.
<b>Excluir da Avaliação Institucional:</b>	Não
<b>Matriculável On-Line:</b>	Sim
<b>Horário Flexível da Turma:</b>	Sim
<b>Horário Flexível do Docente:</b>	Sim
<b>Obrigatoriedade de Conceito:</b>	Sim
<b>Pode Criar Turma Sem Solicitação:</b>	Sim
<b>Necessita de Orientador:</b>	Não
<b>Exige Horário:</b>	Sim
<b>Permite CH Compartilhada:</b>	Não
<b>Permite Múltiplas Aprovações:</b>	Não
<b>Quantidade de Avaliações:</b>	1
<b>Módulo:</b>	
<b>Ementa/Descrição:</b>	Introdução à Microscopia de Varredura por Sonda(Scanning Probe Microscopy-SPM). Microscopia de Força Atômica (AFM): teoria, instrumentação e aplicações das modalidades contato e tapping Mode. Microscopia de Tunelamento (STM). Breve descrição de outras Microscopias: Força Elétrica(EFM).Força Magnética (MFM), Força Lateral. Cantilever: propriedades, escolha, forma da ponta e resolução. Scanner. SPM como uma ferramenta de análise de superfície. Processamento de imagens: tratamentos estatísticos, programas disponíveis, artefatos.

Marcio André Fernandes Martins  
Coordenador Geral do PEI  
SIAPE Nº: 2042153  
Escola Politécnica/UFBA

**Referências:**

**HISTÓRICO DE EQUIVALÊNCIAS**

Expressão de Equivalência	Ativa	Início da Vigência	Fim da Vigência
( <a href="#">ENGN05/20181</a> )	ATIVO	24/11/2022	